#### ДИНАМИКА МЕТАЛЛОВ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНТЕНСИВНЫХ ПОТОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ

<u>Н.Б. Волков<sup>1</sup></u>, Е.А. Жукова<sup>1</sup>, Н.Д. Кундикова<sup>1</sup>, А.Я. Лейви<sup>1</sup>, А.Е. Майер<sup>2</sup>, В.С. Седой<sup>3</sup>, К.А. Талала<sup>2</sup>, Е.Л. Фенько<sup>2</sup>, Н.А. Яворовский<sup>4</sup>, А.П. Яловец<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург <sup>2</sup>Южно-Уральский государственный университет, Челябинск <sup>3</sup>Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск <sup>4</sup>Томский политехнический университет, Томск

Работа поддерживается Министерством образования и науки РФ (госконтракт №02.513.11.3127), ИНТАС (проект №06-1000013-8949), РФФИ (проект №06-08-00355), РФФИ-Урал (проект №07-08-96032) и Президиумом УрО РАН в рамках целевой поддержки междисциплинарных исследований, выполняемых совместно учеными УрО, СО и ДВО РАН.

Рабочее совещание по физике неидеальной плазмы Москва, 4-5 декабря 2007 г.

### Схема эксперимента и параметры облучения.

е⁻ (ионные) пучки



- Низкоэнергетические сильноточные электронные пучки: T<sub>e</sub>~0.5-40 кэВ; j<sub>e</sub>~100-500 A/см<sup>2</sup>; τ ~ 1-50 мкс.
- **2)** Высокоэнергетические сильноточные электронные пучки:  $T_e \sim 0.1-1 \text{ M}$ эB;  $j_e \sim 1-1000 \text{ кA/cm}^2$ ;  $\tau \sim 30-100 \text{ нc}$ .

3) Ультракороткие высокоэнергетические электронные пучки:  $T_e \sim 0.1 - 1 \text{ MeV}, j_e \sim 1 - 100 \text{ kA/cm}^2, \tau \le 1 \text{ ns}.$ 

 4) Мощные ионные пучки (p; p+C; и др.): T<sub>i</sub> ~0.1-2 МэВ; j<sub>i</sub> ~50-1000 А/см<sup>2</sup>; τ ~ 30-100 нс.

5) Мощное лазерное излучение длительностью менее 1 ps.

### Генерация наночастиц с помощью ЭВП в ИСЭ СО РАН





Эффективность использования энергии контура более 0.75

Производительность 50 ÷ 1000 г/час в зависимости от типа порошка

### Теоретические исследования, проводимые в ИЭФ УрО РАН и ЮУрГУ направлены на:

- 1. Получение широкодиапазонных выражений для термодинамических и транспортных характеристик металла при высоких плотностях энергии в одно- и двухтемпературном приближении;
- 2. Моделирование взаимодействия мощных пучков заряженных частиц и лазерного излучения с металлом различной длительности с целью исследования нелинейных механизмов преобразования энергии, кратерообразования, неустойчивостей, перемешивания поверностных слоев мишени;
- 3. Моделирование и исследование нелинейных физических механизмов возбуждения и релаксации сильно неравновесных состояний металла (плазмы твердотельной плотности);
- 4. Разработку физико-математических моделей разрушения проводников электрическим током большой плотности и генерации наночастиц;
- 5. Моделирование динамики разлета продуктов ЭВП в буферный газ с учетом процессов конденсации и испарения.

Экспериментальные исследования, планируемые и проводимые в ИЭФ УрО РАН и ЮУрГУ направлены на установление физических механизмов возбуждения и релаксации сильно неравновесных состояний в металле при воздействии мощных импульсов лазерного и электронного излучения длительностью менее 1 нс. <u>Моделирование перемешивания</u> при облучении многослойных мишеней микросекундным электронным пучком. <u>Механизмы конвекции:</u>

Конвекция в неоднородной среде в поле сил тяжести ρ=ρ(Т) (существенна в закритическом режиме)

- Термокапиллярный механизм σ=σ(T) Необходимые условия Наличие свободной границы, градиент температуры на которой направлен вглубь мишени.
- Термоэлектрический механизм ε=ε(T) (существенен для полупроводников и диэлектриков)



Ячейки Бенара

# Система уравнений Буссинеска в переменных завихренность – функция тока в двумерных декартовых координатах.

$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial t} + (\vec{v}\nabla\xi) = v\Delta\xi + \beta g \frac{\partial T}{\partial x} \\ \frac{\partial T}{\partial t} + (\vec{v}\nabla T) = \chi\Delta T \\ \{\psi = -\Delta\xi \\ \xi = [\nabla, \vec{v}]\}_{y} \\ v_{x} = -\frac{\partial \psi}{\partial z}; v_{z} = \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases}$$

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial T} \qquad z = 0: \ \psi = 0, \ \xi = 0, \ T = T_{0} \\ z = h: \ \psi = 0; \ \xi = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial T}{\partial x}; \ \frac{\partial T}{\partial z} = 0. \end{cases}$$

На поверхности расплава z=h накладывается гармоническое возмущение температуры  $\delta T = \cos(2\pi x/\lambda)$ 

### Алгоритм моделирования конвективного течения

### 1) Расчет поля температур по глубине мишени и агрегатного состояния вещества на момент окончания импульса по программному комплексу BETAIN1.

2) Расчет динамики гармонических возмущений

#### Термокапиллярная конвекция

 $T_e=200$  кэВ, W=30 Дж/см<sup>2</sup>,  $\tau=5$  мкс,  $\lambda=54$  мкм,  $\delta T_0=30$  К.



Положение лагранжевых точек.

• - начальное положение, ° -конечное положение

# $\frac{Mаксимальное смещение}{для различных длин волн <math>\lambda$ и амплитуд $\delta T_0$ возмущения температуры на поверхности расплава



цифры: смещение в мкм

## <u>Моделирование динамики дислокаций и их влияния на свойства металла</u> (в работе принимает участие аспирант ЧелГУ Красников В.С.).

Модель включает себя уравнения механики сплошной среды, кинетики и динамики дислокаций. На рисунках показаны зависимости плотности дислокаций и предела текучести от амплитуды ударной волны в Al (точки – экспериментальные данные [Т. Свенсон. // Ударные волны и явления высокоскоростной деформации металлов. /Под редакцией Мейерса М.А. и Мурра Л.Е. Металлургия. 1984. С.164.]) :



### <u>Механизмы разрушения металлических проводников</u> <u>электрическим током большой плотности</u>

Металлические проволочки, используемые при ЭВП, поликристаллические. Средний размер кристаллитов в зависимости от ее материала, толщины и способа получения может быть  $d \le 100$  нм.



Размер частиц, определенной по эффективной площади наночастиц, уменьшается при уменьшении размера области когерентного рассеяния (среднего размера кристаллита).



Двумерная модель атомной структуры нанокристаллического материала, рассчитанная с использованием потенциала Морзе: о – атомы кристаллитов, • - атомы границ раздела, смещенные относительно узлов идеальной кристаллической решетки более чем на 10%; все атомы химически идентичны [H. Gleiter. // Nanostruct. Mater., 1995. V. 6. No. 1-4. P.3.].



Схематическое представление наноструктурного материала со средним размером зерен около 100 нм (а) (треугольники разного размера и ориентации обозначают дисклинации различной мощности и знака), где вблизи неравновесных границ зерен формируются упруго-искаженные области, и зернограничные дефекты и искажения кристаллической решетки в наноструктурном материале с размером зерен 10-20 нм (б) [Р.З. Валиев, И.В. Александров. Объемные наноструктурные металлические материалы.-М.: ИКЦ «Академкнига, 2007].

Удельное сопротивление поликристаллической проволочки с учетом рассеяния электронов проводимости на границах кристаллитов может быть оценено по формуле, полученной в работе [A.F. Mayadas, M. Shatzkes. //*Phys. Rev. B*, 1970. V. 1. No.4. P.1382-1389.]:

$$\frac{\rho_0}{\rho_g} = 1 - \frac{3}{2}\alpha + 3\alpha^2 - 3\alpha^3 \ln\left(1 + \frac{1}{\alpha}\right), \qquad (I)$$

где  $\rho_g, \rho_0$  -удельное сопротивление проволочки с учетом и без учета размерного эффекта, соответственно;  $\alpha = l_0 R/dD$ ;  $l_0$  - длина свободного пробега электрона без учета рассеяния на границах кристаллитов; R, D = 1 - R - соответственно, коэффициент зеркального отражения и прозрачность потенциального барьера, моделирующего границу кристаллита. При  $\alpha \gg 1$  справедлива асимптотика

$$\rho_g = 4\alpha \rho_0 / 3. \quad \text{(II)}$$

Формула (I), как показано в [Р.З. Валиев, И.В. Александров. Объемные наноструктурные металлические материалы.-М.: ИКЦ «Академкнига, 2007], при *R* = 0.23 удовлетворительно описывает сопротивление проводников с размером кристаллитов от 300 нм до 13 мкм.

Зависимости *R* и *R/D* от высоты потенциального барьера, полученные численным решением задачи о рассеянии электрона (волнового пакета шириной 2 Å) с энергией Ферми на потенциальном барьере шириной 3 Å.



В случае  $\alpha \gg 1$  выравнивание температуры по кристаллиту определяется не

электронной, а фононной теплопроводностью (!), которая пропорциональна 1/T.



Отношение характерного времени выравнивания температуры по кристаллиту к времени пробега электрона с энергией Ферми через кристаллит в зависимости от его размера для меди: 1 - T =1356 K; 2 - T = 800 K; 3 - T =300 K.

Вывод: <u>проводник с размером кристаллитов меньшим 100 нм к моменту</u> взрыва можно рассматривать как гетерогенную среду с существенно неоднородным распределением температуры.

# Моделирование разлета продуктов ЭВП: основные положения модели

1.Средний по объему тензор деформации гетерогенной смеси:

$$u_{ik} = \sum_{i} \alpha^{(j)} u_{ik}^{(j)}$$

2.Средний по объему тензор скоростей деформации гетерогенной смеси:

$$v_{ik} = \sum_{i} \alpha^{(j)} v_{ik}^{(j)}$$

3.Все компоненты равноправны и движутся в одном и том же поле напряжений. Обычно рассматривают линейную зависимость тензора напряжений от тензора деформации, тогда тензор напряжений имеет вид:  $\sigma_{ik} = \sum_{i} \alpha^{(j)} \sigma_{ik}^{(j)}$ 

4. Давление гетерогенной смеси:

$$P = \sum_{i} \alpha^{(j)} P^{(j)}$$

5.Элементарная работа, совершаемая при деформации гетерогенной среды в единицу времени в единице объема гетерогенной смеси:

$$\dot{A} = \sigma_{ik} v_{ik} = \sum_{j} \alpha^{(j)} \sigma_{ik}^{(j)} v_{ik} = \sum_{j} \dot{A}^{(j)}$$

6.Работа ј-компоненты, совершаемая над всей гетерогенной средой в единицу времени в единице объема:

$$\dot{A}^{(j)} = \alpha^{(j)} \sigma_{ik}^{(j)} v_{ik}$$

### Система уравнений механики гетерогенных сред

Уравнения механики гетерогенных сред записаны с учетом теплопроводности в отсутствии обмена теплом между компонентами через межфазную поверхность и в отсутствии фазовых превращений. Эти процессы учитываются добавлением соответствующих слагаемых в сформулированные ниже уравнения:

Уравнение непрерывности для т-компоненты:

$$\frac{\partial \rho^{(m)}}{\partial t} + \nabla \left( \rho^{(m)} \vec{v}^{(m)} \right) = 0$$

Уравнение движения для т-компоненты:

$$\rho^{(m)}\left(\frac{\partial v_i^{(m)}}{\partial t} + \left(v_k^{(m)}\frac{\partial}{\partial x_k}\right)v_i^{(m)}\right) = \alpha^{(m)}\frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k}$$

Уравнение внутренней энергии для m-компоненты:

$$\rho^{(m)}\left(\frac{\partial U^{(m)}}{\partial t} + \left(v_k \frac{\partial}{\partial x_k}\right)U^{(m)}\right) = \alpha^{(m)}\sigma^{(m)}_{ik}v_{ik} + \frac{\partial}{\partial x_k}\left(\alpha^{(m)}\kappa^{(m)}\frac{\partial T^{(m)}}{\partial x_k}\right)$$

Система уравнений решается в системе координат, связанной с движением центра масс всей смеси совместно с уравнениями кинетики конденсации и испарения наночастиц.

### Результаты моделирования разлета продуктов ЭВП с учетом кинетики испарения и конденсации



### Вывод

Таким образом, можно считать доказанным, что:

- 1. Разрушение наноструктурного проводника электрическим током большой плотности происходит по межкристаллитным границам;
- 2. Размер металлических наночастиц, получаемых при разлете продуктов ЭВП в буферный (инертный) газ, определяется распределением кристаллитов по размерам в проволочке.